

SEM(走査電子顕微鏡)観察/ EDX(エネルギー分散型 X 線分析装置)分析

SEM(走査電子顕微鏡)は、電子線を試料に充てることにより、出てくる電子情報をもとに、試料の凹凸や組成の違いによるコントラストを見ることができます。また、さらにEDX(エネルギー分散型 X 線分析装置)を組み合わせることにより、元素分析が可能となり、特定部位の元素分析や元素濃度のマッピングも可能です。

近年ではナノテクノ材料や部品の小型化、微細加工が進み、高倍率で焦点深度が深い電子顕微鏡観察や分析器による材料の構成、不純物の分析等が必要不可欠になっています。弊社では走査型電子顕微鏡(SEM)/エネルギー分散型 X 線分析装置(EDX)を**皆様のニーズに応じて**ご利用いただけるサービスを行っております。

これらの装置は、故障解析や品質管理、材料分析などにご利用いただけます。SEM では下記のような観察が可能です：

表面観察	断面観察	故障解析	寸法測定
● 付着物の形状観察	● VIA の観察	● 不良箇所の特定	● 寸法確認
● 剥離面の状態観察	● 阻止断面の観察	● レイヤー解析	● 膜厚測定
● 表面の平坦性	● ボイドの確認	● 金属疲労の評価	● ウェルドの評価

使用例

★お客様が立ち合いのうえ観察、分析

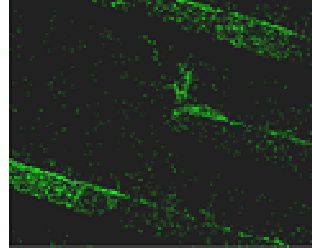
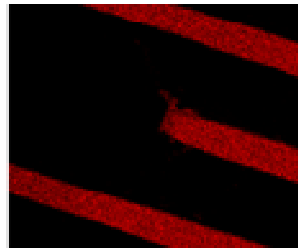
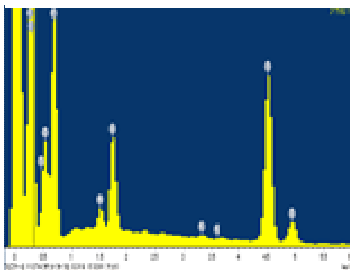
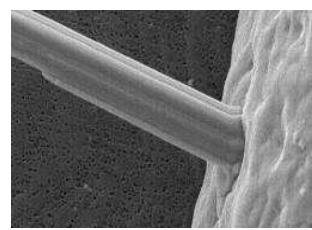
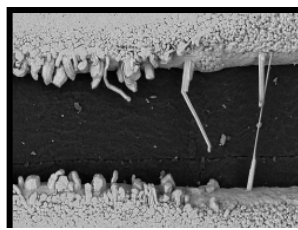
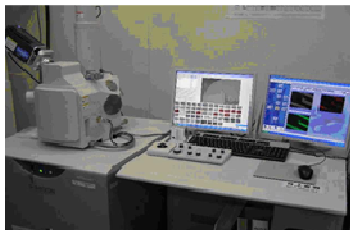
お客様に立ち合っていたいただき、観察箇所、分析箇所を確認しながら作業を行います。

★オペレーター付き時間貸し

予約時間内でお客様指示のもと、オペレーターが作業を行います。

★前処理も可能

サンプルの樹脂埋め～断面研磨、観察面の表面処理まで実施致します



EDX 分析事例(デンドライトマッピング)

お問い合わせ先

Chemitox

株式会社ケミトックス

URL: <http://www.chemitox.co.jp>

東京本社/〒145-0064 東京都大田区上池台 1-14-18

Tel: 03-3727-7111/Fax: 03-3728-1710

電子回路安全・信頼性技術部 営業技術担当

渡邊 (h-watanabe@chemitox.co.jp)